Proceedings of the 23rd Linear Accelerator Meeting in Japan (September 16 - 18, 1998, Tsukuba, Japan)

(F18p08)

## OPTICAL AND MEASUREMENT SYSTEM FOR FELAT NIHON UNIVERSITY

Y. Hayakawa, K. Hayakawa, I. Sato, K. Sato, T. Tanaka, I. Kawakami, Y. Matsubara, \*H. Nakazawa, \*K. Yokoyama, \*K. Kanno, \*Y. Matsumoto, \*\*H. Kobayashi, \*\*A. Enomoto, \*\*T. Kamitani, \*\*M. Kato, \*\*K. Tsuchiya, \*\*S. Anami, \*\*\*A. Iwata, \*\*\*M. Kawai, \*\*\*K. Nomaru, \*\*\*F. Oda

> Atomic Energy Research Institute, Nihon University 7-24-1 Narashinodai, Funabashi, 274-8501 Japan \*College of Science and Technology, Nihon University 7-24-1 Narashinodai, Funabashi, 274-8501 Japan \*\*High Energy Accelerator Research Organization, KEK 1-1 Oho, Tsukuba, 305 Japan \*\*\*Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 118 Futatsuzuka, Noda, 278 Japan

### Abstract

The measurement system for FEL at Nihon University has been developed. It consists of a spectrometer with a grating and a photomultiplier, a signal of which is processed by a PC through an integral circuit and an ADC. The ADC and a stepping motor of the spectrometer are controlled so that a multi-channel analysis for the spectrum is possible. Visible undulator radiation was brought out from the cavity using a half mirror and transported to the spectrometer by eight mirrors. The spectrum of the radiation was measured and has a width of 25nm in FWHM, which is larger than the theoretical width or the resolution of the measurement system.

# 日大FELの光学計測系

# <u>1. はじめに</u>

日大原子力研究所電子線利用研究施設(AERI) において紫外線領域 FEL が計画され、そのための 電子線型加速器およびアンジュレータの建設が 1994 年度から始められた[1]。1998 年 2 月には電 子ビームをアンジュレータに通すことに成功し[2]、 可視光領域の放射光が観測されるに至った。ここ では、このアンジュレータ放射光のスペクトルを 測定するために構築された光学輸送系および分光 システムについて報告する。

## 2. アンジュレータおよび光学輸送系

AERI のアンジュレータ(Halbach)のパラメ ータは周期長 24mm、周期は 100、常用 K 値は 0.7 である[3]。現在は波長 488nm での自由電子レー ザー発振を目指しており、光共振器にはこの波長 に合わせた多層膜反射鏡を使用している。レーザ ー発振を実現するためには、発生するアンジュレ ータ光の特性、特にそのスペクトルを詳しく調べることが重要である。そのために、アンジュレータの下流にハーフミラー(ビームスプリッター)



図1.アンジュレータ放射光の輸送経路
1)アンジュレータ、2)ビームスプリッター、
3)共振器ミラー、4)~11)反射鏡、
12)分光器



図2. 放射光スペクトル測定システムの概念図

を挿入してアンジュレータ放射光をキャビティの 外に取り出し、それを分光することにした。図 1 にその様子を示す。ビームスプリッターで取り出 された放射光は計 8 枚の反射鏡を用いてリニアッ ク制御室に設置された分光器まで輸送される。ビ ームスプリッターから分光器までの光路はおよそ 30m になる。

### 3. 光計測システム

反射鏡で運ばれてきた放射光はグレーティング を用いた分光器 (ニコン製モノクロメータ G-250) によって分光され、そのスペクトルが測定される。 今回使用した分光器の仕様は表1のようになって いる。放射光のスペクトルを得るには、分光器で 分光された光の強度を測定する必要があるが、分 光後の光の強度は大変弱いため光検出器としては 光電子増倍管を採用することにした。光電子増倍 管のシグナルは積分回路で処理され、光の強度は

<b>±</b> 1	TIDE	- 1 7 1	(0.050)	の仕様
衣工.	モノクレ	コメーク	(G-200)	の江体

光学型式	Czerny-Turner 型		
回折格子			
刻線本数	600 本/mm		
刻線面積	$52 \times 52 \mathrm{mm}$		
逆線分散	6nm/mm (理論値)		
光学的波長範囲	170~1600nm		
波長精度	0.3nm		
波長再現性	0.1nm		
分解能	0.2nm		
	スリット幅 0.01mm		
	スリット長さ 4.0mm		
	<b>546nm</b> における半値幅		

パルス波高に変換される。このパルスを市販の ADC ボードによってパソコン (PC-9821) に取り 込み、データ処理を行う。積分回路と ADC の間 にはサンプルホールドが入れてあり、そのゲート とリセットにはリニアックのトリガーパルスを用 いているのでビームと同期したシグナルのみが計 測されるようになっている。この計測システムの 概念図を図2に表す。

分光器にはパルスモータが取り付けられており、 それによってグレーティングの回転角すなわち分 光する光の波長を変えることができる。これもパ ソコン用ステッピングモータコントローラボード を用いてコントロールすることにした。パルスモ ータと ADC を連動させることにより、横軸が光 の波長、縦軸が光の強度となるようなマルチチャ ンネル分析 (MCA) が可能となる。このため、 MS-DOS 用 MCA プログラムの開発を行った。こ の MCA システムを用いてアンジュレータ放射光 のスペクトル測定を行う。

### 4. アンジュレータ放射光スペクトルの測定

上記のシステムによって実際にアンジュレータ 放射光のスペクトルを測定した。電子ビームのエ ネルギー97MeV、アンジュレータのギャップ間隔 13mm(K値0.82)、分光器のスリット幅0.5mm (波長分解能5nmに相当)という条件では図3の ようなスペクトルが得られた。このスペクトルは 長波長側にテールを引いた形状をしている。また、



図3.アンジュレータ放射光のスペクトル 電子ビームエネルギー97MeV、アンジュレータギ ャップ間隔13mm、分解能5nmで測定

スペクトルの幅は半値幅で 25nm (5%) あり、ア ンジュレータの周期数で決まる理論的な線幅 (1%) や電子ビームのエネルギー分散 (0.5%) [4] に比べて広くなっている。図 4 は電子ビームエネ ルギー97MeV、アンジュレータギャップ間隔 12.24mm (K値 0.91) で発生した放射光を 488nm



図4. バンドパスフィルタ通過後のスペクトル 電子ビームエネルギー97MeV、アンジュレータギ ャップ間隔 12.24mm、分解能 2nm で測定 フィルタの仕様は 488nm を中心に半値幅 10nm のバンドパスフィルタ(半値幅 10nm)を通し、 スリット幅 0.2mm(波長分解能 2nm)で測定し たものである。得られたスペクトルの半値幅は 9nm(2%)で、ほぼフィルタの仕様通りの幅であ った。従って、測定系のもつ分解能はそれ以下で あり、スペクトルの幅が広い原因は他にあると考 えられる。この原因としてはビーム電流の揺らぎ やビームのエミタンス、観測の見込み角の影響が 考えられる。特にビームの角度分布に伴う見込み 角の効果はスペクトルが長波長側にテールを引く 形をしている原因になっているものと思われる[5]。

## 5. 今後の課題

今回のスペクトル測定では測定回数を多くする ことによりビーム電流が平均化されると仮定して いる。しかし、より正確で効率の良いスペクトル 測定を行うためにはビーム電流モニターの出力を パルスごとに積分し、その値をデジタル化して取 り込んでスペクトルの規格化に用いる必要がある。 現在、この規格化のための回路およびソフトウェ アを開発中である。

また、今回はキャビティ内にビームスプリッタ ーを挿入することによって放射光を取り出してス ペクトルを測定しているが、レーザー発振の条件 を調べるという意味ではキャビティ内にハーフミ ラーが入っているのは好ましくない。今後、強度 は弱くなるが、共振器ミラーを透過してくる放射 光を取り出してそのスペクトルを調べていく。こ れに続いてアンジュレータ光がキャビティに蓄積 されていく様子やレーザー発振の兆候を捕らえる ことを試みる予定である。

### Reference

- K. Hayakawa et al., Proc. of 21st Linear Accelerator Meeting in Japan, (1996) 20.
- [2] T. Tanaka et al., Proc. of this meeting.
- [3] I. Sato et al., Proc. of 22nd Linear Accelerator Meeting in Japan, (1997) 104.
- [4] K. Yokoyama et al., Proc. of this meeting.
- [5] H. Nakazawa et al., Proc. of this meeting.